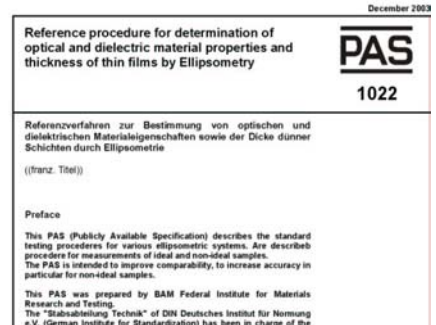


Arbeitskreis Plasmaoberflächentechnologie
Fachausschuß Normung
Bericht zur Herbstsitzung 10./11.11.2003 Bremen

DIN Normenausschuß Feinmechanik und Optik;
AA O3 Dünne Schichten für die Optik

- ▶ **ISO-CD 9211- 4**
Optics and optical instruments - Optical coatings -
Part 4: Specific test methods
2. Überarbeitung
- ▶ **DIN 58 197-4 Dünne Schichten für die Optik -**
Teil 4: Mindestanforderungen an Schichten für die
Lasieranwendungen
- ▶ **PAS 1022 Ellipsometrie**
Bestimmung von optischen und dielektrischen
Materialeigenschaften sowie von Schichtdicken wenigstens
semitransparenter dünner Schichten.
Fertiggestellt und dem DIN/Beuth-Verlag zum Druck übergeben.
Druck soll noch in 2003 erfolgen. Vertrieb erfolgt dann durch die BAM.



Interessenten wenden sich bitte an Dr. U. Beck (BAM VIII.2901, Tel.: 030/8104-1821 oder -1829, FAX: - 1827, Email: uwe.beck@bam.de)

VDI-Gesellschaft Produktionstechnik; Richtlinien-Fachausschuß
VDI 2840 Kohlenstoffschichten; Übersicht über Schichttypen und Eigenschaften.

Der Gründruck wurde im Oktober 2003 verabschiedet.
Die Arbeit an der Richtlinie diamantbeschichtete Werkzeuge wurde aufgenommen.

VDI-W : VDI-Richtlinie # 3823 „Qualitätssicherung bei der Vakuumbeschichtung von Kunststoffen“

- Blatt 1: "Eigenschaften, Anwendungen und Verfahren"
- Blatt 2: "Anforderungen an zu beschichtende Kunststoffteile"
- Blatt 3: „Fertigungsabläufe und Tätigkeiten“
- Blatt 4: "Prüfplanung für vakuumbeschichtete Kunststoffteile"

Im September 2003 wurden alle 4 Blätter als Gründruck verabschiedet.
Mit der Veröffentlichung (Druck) wird im ersten Halbjahr 2004 gerechnet.

VDI/VDE-GMA-Fachausschuß FG 3.40 „Metrologie in der Mikro- und Nanotechnik“

Auf Initiative von

- Dietzsch (TU Chemnitz),
- Pfeifer (RWTH Aachen)
- Reiners (BAM),
- Sauer (TU Dresden)
- Weckenmann (Uni Erlangen-Nürnberg),
- Westkämper (FhG IPA Stuttgart)
- Wurmus (TU Ilmenau)

Ausschreibung

DFG-Schwerpunktprogramm 1159

**Deutsche
Forschungsgemeinschaft**

DFG, Kennedyallee 40, 53175 Bonn / Postanschrift: DFG, 53170 Bonn

Der Präsident

Geschäftsstelle
Kennedyallee 40
Bonn - Bad Godesberg

Fragen beantwortet
Dr.-Ing. Andreas Engelke

Telefon 0228/885-2523
Telefax 0228/885-2777
www http://www.dfg.de
E-Mail andreas.engelke@dfg.de

Bonn, den 07.10.2003
GZ: ING 7 – SPP 1159

Schwerpunktprogramm 1159: Neue Strategien der Mess- und Prüftechnik für die Produktion von Mikrosystemen und Nanostrukturen

DIN NMP 161 Schichtdickenmessung

- ▶ DIN EN ISO 10308 Metallische Überzüge - Übersicht der Porenprüfverfahren (ISO/DIS 10308:2003) 2. Mai 2003 erschienener Normentwurf
- ▶ DIN EN ISO 21968 Nichtmagnetische metallische Überzüge auf metallischen und nichtmetallischen Grundwerkstoffen - Messung der Schichtdicke - Wirbelstromphasenwechselverfahren (ISO/DIS 21968:2003) 1. August 2003 erschienener Normentwurf

DIN NMP 141 Härteprüfung : ISO/DIS 14577 Metallic materials - Instrumented indentation test for hardness and materials parameters

- ▶ **DIN EN ISO 14577** Instrumentierte Eindringprüfung zur Bestimmung der Härte und anderer Werkstoffparameter. Blatt 1 bis 3 sind Mai 2003 erschienen.
- ▶ **ISO/CD 14577-4** Metallic materials – Instrumented indentation test for hardness and materials parameters – Part 4: Test method for coatings wird im Frühjahr 2004 erscheinen.

ISO TC 107/SC 3 New Work Item Proposal zu PVD

- N586 "Metallic Coatings – Vapour deposited coatings of cadmium on iron and steel – Specification and test methods", 30.9.2001
- N587 "Metallic Coatings – Vapour deposited coatings of aluminium – Specification and test methods", 30.9.2001

ISO/TC 201 Oberflächenanalytik : Aktueller Stand

- Vorschlag aus Korea: Neugründung eine Subkomitees „Scanning probe microscopy“

Status der Normenentwicklung durch ISO/TC 201:

Insgesamt: 34; ISO: 11, ISO/TR: 1, ISO PS: 1, FDIS: 1, DIS: 6, CD: 6, WD: 7, AWI: 1

NEU:

- ▶ ISO 17560:2002 Surface chemical analysis -- Secondary-ion mass spectrometry -- Method for depth profiling of boron in silicon
- ▶ ISO 17973:2002 Surface chemical analysis -- Medium-resolution Auger electron spectrometers -- Calibration of energy scales for elemental analysis
- ▶ ISO 17974:2002 Surface chemical analysis -- High-resolution Auger electron spectrometers -- Calibration of energy scales for elemental and chemical-state analysis

(ISO= International Standard; PRF= Proof of a new International Standard; FDIS= Final Draft International Standard; ISO/TR= ISO Technical Report; DIS= Draft International Standard; CD= Committee Draft ; WD= Working Draft ; AWI= Approved Work Item; NP= New Work Item Proposal)

Weitere Informationen zum laufenden Arbeitsprogramm sind verfügbar unter :

http://www.bam.de/kompetenzen/arbeitsgebiete/abteilung_8/fachgruppe_82/laboratorium_823.htm

ISO/TC 202 : AktuellerStand

- 4 Subkomitees sowie weitere 4 Arbeitsgruppen, die direkt dem TC Sekretariat unterstellt sind (Die bisherige AG 3 "SEM" wurde in ein Subkomitee umgewandelt)

Status der Normenentwicklung durch ISO/TC 202 (FDIS: 1, DIS: 1, CD: 5, WD: 1):

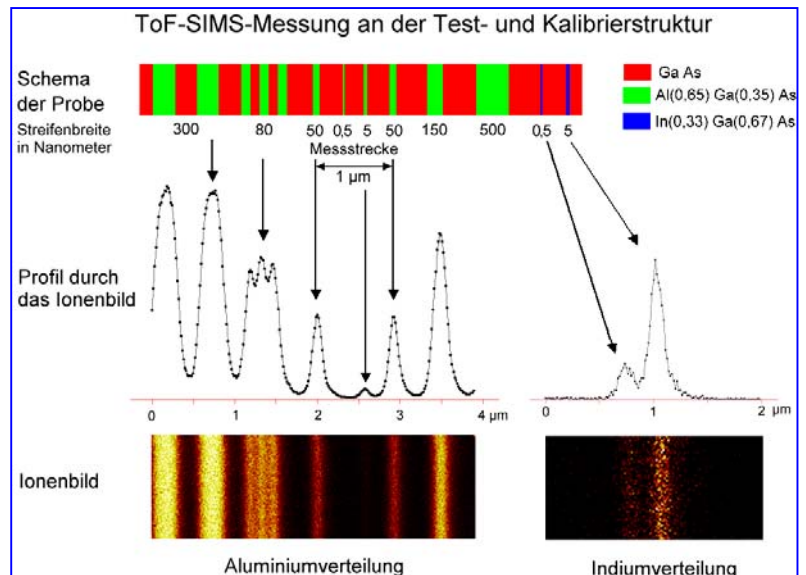
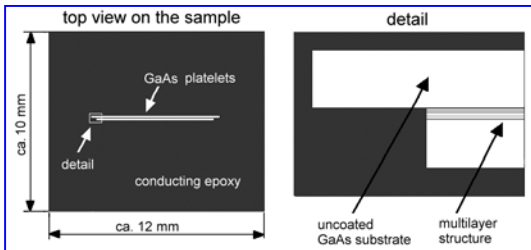
Nr	Inhalt der Norm	Status
ISO 15632	Spezifikationen für energiedispersive Röntgenspektrometer	FDIS (50.00)
ISO 16700	Vorschrift zur Kalibrierung der Vergrößerung am REM	CD (30.20)
ISO 22029	EMSA/MAS Standard file format for spectral data exchange	DIS (40.60)
ISO 14594	Testmethoden für Elektronenstrahl-Mikrosonden	CD (30.99)
ISO 15595	Anforderungen an ein CRM für die Elektronenstrahl-Mikroanalyse	CD (30.99)
ISO 17470	Vorschrift zur qualitativen Elektronenstrahl-Mikroanalyse	CD (30.20)
ISO 22489	Anleitung zur quantitativen Punktanalyse bei der ESMA	NP (10.20)
ISO 22309	Anleitung zur quantitativen Analyse mittels EDX	WD (20.20)
ISO 17270	Vorschrift zur Durchführung der ELS am STEM	AWI (20.00)
ISO 23833	Vokabular	CD (30.20)

Web-Seite zur Information über die ISO TC202-Aktivitäten: www.msa.microscopy.com/ISO/

Weitere Informationen zum laufenden Arbeitsprogramm sind verfügbar unter :

http://www.bam.de/kompetenzen/arbeitsgebiete/abteilung_8/fachgruppe_82/laboratorium_823.htm

- ▶ **BAM-L002**
Nanometric Lateral Resolution Test and Calibration Sample (GaAs/AlGaAs-Multilayer incl. InGaAs quantum well)



Weitere Informationen zum laufenden Arbeitsprogramm sind verfügbar unter :
http://www.bam.de/kompetenzen/arbeitsgebiete/abteilung_8/fachgruppe_82/laboratorium_823.htm

- ▶ **BAM-L003**
Mono- und Multilayer-Coatings



PSE 2004 Workshop zu Standardisierung, Entwicklung von Referenzmaterialien und Validierung von Prüfverfahren

Federführung durch BAM gemeinsam mit TC 184 WG 5, VITO, NPL und VDI TZ.

gez. G. Reiners

Tel.: 030/8104-1820; FAX: -1827, Email: georg.reiners@bam.de, <http://www.bam.de/fg-82.htm>